

Storm 计算可靠性相关引理及定理证明

符号及其对应含义如下表：

符号	含义	符号	含义
sp	输出组件	bt	处理组件
cid	组件中的标识	id	组件读入或发送的元组标识
mid	输入组件发送的元组（原始元组）标识	sid	元组流的标识
TE	迁移事件集合	RE	storm 拓扑运行的事件集合
stp	storm 计算拓扑	M	Net 库所标识映射 (Marking)
Net	storm 计算拓扑对应 CPN 模型	b	Net 迁移中变量的赋值
t	Net 迁移发生的时间	$[]: var \rightarrow \Sigma$	赋值映射

Storm Net 中的迁移触发时将产生迁移事件，其定义如下：

定义 1（迁移事件）迁移事件 $te = \langle tr, b, t \rangle$ ，其中：

- $tr \in TR$ 是迁移；
- $b: V \rightarrow \Sigma$ 是迁移发生时的状态，即对相关变量的赋值；
- $t \in TIME$ 表示迁移 tr 发生在时刻 t 。

$te = \langle tr, b, t \rangle \in TE$ 表示在时刻 t 和状态 b 条件下发生了迁移 tr 。符号 TE 表示所有的迁移事件集合。

定义 2（可执行的迁移事件 te ）给定 Marking M ，时间 t^* 及迁移事件 te ， te 在 $\langle M, t^* \rangle$ 条件下

可发生迁移的，记为 $\langle M, t^* \rangle \xrightarrow{te} \langle M', t' \rangle$ ，当且仅当以下条件满足的：

- $t' \geq t^*$ ；
- 对迁移 tr 的所有库所 $p, E(p, tr) \langle b \rangle \leq M(p)$ ，即输入库所存在足够的托肯供迁移 tr 消耗。
- 当迁移事件 te 在 $\langle M, t^* \rangle$ 下是可执行的，则 tr 发生后，Marking M' 可以定义为：

$$M'(p) = (M(p) - E(p, tr) \langle b \rangle_{+t}) + E(tr, p) \langle b \rangle_{+t}。$$

定义 3（Storm 的迁移事件） $TE = TE(sp) \cup TE(bt) \cup \overline{sAck} \cup \overline{sFail}$ 表示 Net 迁移事件集合，其中：

— $TE(sp) = \overline{take(sp)} \cup \overline{semit(sp)}$ ，表示输出组件对应的迁移事件集合；

— $TE(bt) = \overline{take(bt)} \cup \overline{emit(bt)} \cup \overline{ack(bt)} \cup \overline{fail(bt)}$ ，表示处理组件对应的迁移事件集合，

由 $take$, $emit$, ack , $fail$ 类型迁移构成。

— $\overline{sAck} = \{(sAck, b, t)\}$ ，表示计算确认迁移事件集合；

— $\overline{sFail} = \{(sFail, b, t)\}$ ，表示计算失败迁移事件集合；

定义 4 (Storm 的运行事件) $RE = RE(sp) \cup RE(bt) \cup RE(ack)$ 表示 stp 运行时日志事件集合，其中：

— $RE(sp) = \{semit(cid, mid, sid, t)\}$ ，表示标识为 cid 的输出组件在 t 时刻发送标识为 mid 的元组至元组流 sid 中。

— $RE(bt) = \{take(cid, id, mid, sid, t)\} \cup \{emit(cid, id, mid, sid, t)\} \cup \{fail(cid, id, mid, t)\} \cup \{ack(cid, id, mid, t)\}$ ；

— $RE(ack) = \{sAck(mid, t)\} \cup \{sFail(mid, t)\}$ 。

RE 和 TE 两类事件中间存在的映射关系由下述定义确定。

定义 5 (RE 到 TE 的映射) 给定 Storm 拓扑 stp ， RE 事件集到 TE 迁移事件集的映射关系由映射函数

$rt: RE \rightarrow \overline{TE}$ ，通过如下规则定义：

— 当 $e = semit(cid, mid, sid, t) \in RE(sp)$ ，其中设 v_0 为输出组件 sp 读入的数据， tup_0 为发送的元组，则 $rt(e) = tk \cdot se$ ，其中

■ $tk = (take(cid), [v \mapsto v_0], t^-) \in \overline{take(sp)}$ ；

■ $se = (semit(cid, so_i), [tup \mapsto tup_0], t) \in \overline{semit(sp)}$, ($so_i.sid = sid$)；

— 当 $e = take(cid, id, mid, sid, t) \in RE(bt)$ ，其中设 tup_0 为组件 bt 从元组流 sid 中读取的元组 ($tup_0.id = id$, $tup_0.mid = mid$)，则 $rt(e) = tk$ ，其中 $tk = (take(cid), [tup \mapsto tup_0], t) \in \overline{take(bt)}$ ；

— 当 $e = emit(cid, id, mid, sid, t) \in RE(bt)$ ，设 tup_0 为组件 bt 向元组流 sid 中发送的元组 ($tup_0.id = id$, $tup_0.mid = mid$)，则 $rt(e) = et$ ，其中 $et = (emit(cid, so_i), [tup \mapsto tup_0], t) \in \overline{emit(bt)}$ ；

— 当 $e = fail(cid, id, mid, t) \in RE(bt)$ ，则 $rt(e) = fa$ ，其中 $fa = (fail(cid), [re \mapsto (cid, mid, FALSE)], t) \in \overline{fail(bt)}$ ；

— 当 $e = ack(cid, id, mid, t) \in RE(bt)$ ，则 $rt(e) = (ack(cid), [re \mapsto (id, mid, TRUE)], t) \in \overline{ack(bt)}$ ；

— 当 $e = sAck(mid, t)$ ，则 $rt(e) = (sAck, [re \mapsto (mid, TRUE)], t) \in \overline{sAck}$ ，其中 re 为所有处理组件中的变量；

— 当 $e = sFail(mid, t)$ ，则 $rt(e) = (sFail, [re_0 \mapsto (mid, FALSE)], t) \in \overline{sFail}$ ，其中 re_0 为某个调用 $fail$ 方法的组件中的结果变量。

设 $\bar{\sigma} \in \overline{RE}$ 为运行迹， $\overline{rt}(\bar{\sigma}) \in \overline{TE}$ 定义为：若 $\bar{\sigma} = \bar{\sigma}' \cdot e$ ，则 $\overline{rt}(\bar{\sigma}) = \overline{rt}(\bar{\sigma}') \cdot rt(e)$ 。

Storm 拓扑 stp 运行迹与对应 Net 的迁移迹满足如下关系：

引理 1 设 Storm 拓扑 stp ，及对应的 Net ，如果 $\bar{\sigma}$ 为 stp 关于输入数据 v 的完整运行迹，则 $\overline{rt}(\bar{\sigma})$ 为

Net 关于 v 的完整迁移迹。

证明：

(1) $\overline{rt}(\bar{\sigma})$ 为 Net 关于 v 的迁移迹。

对 $\bar{\sigma}$ 的长度 $n = |\bar{\sigma}|$ 进行归纳假设。

当 $n=1$ 时，根据 Storm 拓扑的执行语义和事件打点方式可知，此时 $\bar{\sigma} \in semit(cid, mid, sid, t)$ 表示 Storm 首先在输出组件 cid 中，在 t 时刻完成发送元组 mid 至元组流 sid 中。 $\overline{rt}(\bar{\sigma}) = tk \cdot se \in \overline{TE}$ ，显然满足， $\langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{tk \cdot se} \langle M, t \rangle$ ，其中 $M_0(p_0) = v$ ， $M(p_{so_i}) = tup$ ， $(so_i.id = sid, tup.id = mid)$ 即 $\overline{rt}(\bar{\sigma})$ 为 Net 的迁移迹。

设 $|\bar{\sigma}| \leq n$ 时上述命题成立，则当 $|\bar{\sigma}| = n+1$ 时，令 $\bar{\sigma}[n] = e$ ， $\bar{\sigma}[n+1] = e'$ 。

由假设可知， $\bar{\sigma}[0:n]$ 满足上述命题，则存在 M_0, t^-, M' ，使得 $\langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{\overline{rt}(\bar{\sigma}[0:n])} \langle M^-, t^- \rangle$ 。

下面须证明，存在 Net 的库所标识 M' ，使得

$$\langle M^-, t^- \rangle \xrightarrow{rt(e')} \langle M', t \rangle。$$

对 e, e' 之间的关系进行讨论。

a) 当 $e = semit(cid, mid, sid, t)$ 时，由于 $\bar{\sigma}$ 为处理输入 v 的运行迹。则 $e' = semit(cid, mid', sid', t')$ 或 $e' = take(cid', id, mid, sid, t')$ ，即同一输出组件发送其他元组至其他元组流中，或后续组件消费订阅的元组。根据迁移事件 $rt(e)$ 的定义可知，

$$\langle M^-, t^- \rangle \xrightarrow{\overline{rt}(e')} \langle M', t \rangle，M' \text{ 满足：}$$

当 $e' = semit(cid, mid', sid', t')$ 时， $M'(p_{so_i'}) = tup'$ ，其中， $so_i'.sid = sid'$ ， $tup'.id = mid'$ 。

当 $e' = take(cid', id, mid, sid, t')$ 时， $M'(p_{so_i'}) = \emptyset^1$ ， $M'(p_{ready}^{cid'}) = \emptyset$ ， $M'(p_{val}^{cid'}) = val(tup)$ ，

$M'(p_{re}^{cid'}) = res(tup)$ 。其中， $tup.id = mid$ ， tup 为组件 cid' 读入的元组。对其他 $p \in Net$ ，

$M'(p) = M^-(p)$ 。从而可知， $\langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{\overline{rt}(\bar{\sigma}[0:n])} \langle M^-, t^- \rangle$ 即 $\overline{rt}(\bar{\sigma})$ 为 Net 的迁移迹。

b) 当 $e = take(cid, id, mid, sid, t)$ 时，根据 id, cid, mid 的关联性， e' 可分成两类：即

(b.1) e 与 e' 相互独立。即 $e.id \neq e'.id$ 且 $e.cid \neq e'.cid$ ，则设 $\bar{\sigma}' = \bar{\sigma}[0:n-1] \cdot e' \cdot e$ ，即交换 e 和 e' 顺序，则 $\bar{\sigma}'$ 与 $\bar{\sigma}[0:n-1] \cdot e'$ 仍为 stp 的运行迹，且 $|\bar{\sigma}[0:n-1] \cdot e'| = n$ ，此时，根据归纳假设， $rt(\bar{\sigma}[0:n-1] \cdot e')$ 为 Net 的迁移迹，且满足

$$\langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{rt(\bar{\sigma}[0:n-1] \cdot e')} \langle M^-, t^- \rangle。$$

由于 e 与 e' 的独立性，则 $rt(e)$ 与 $rt(e')$ 也相互独立，故 M^- 满足

$$\langle M^-, t^- \rangle \xrightarrow{rt(e)} \langle M', t \rangle。因此 \bar{\sigma}' 与 \bar{\sigma} 都满足 \langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{\overline{rt}(\bar{\sigma})} \langle M', t \rangle，$$

$$\langle M_0, 0 \rangle \xrightarrow{\overline{rt}(\bar{\sigma}')} \langle M', t \rangle。即 \overline{rt}(\bar{\sigma}') 为 Net 的迁移迹。$$

(b.2) e 与 e' 相关联。若 $e.id = e'.id$ 且 $e.cid = e'.cid$ 时，则 $e' = fail(cid, id, mid, t)$ 或 $ack(cid, id, mid, t)$ 。根据 val 和 res 函数的定义可知：

¹ $M'(p_{so_i'}) = \emptyset$ 表示库所无托肯

$$\langle M^-, t^- \rangle \xrightarrow{rt(e')} \langle M', t \rangle,$$

若 $e.id \neq e'.id$, $e.cid = e'.cid$, $e.mid = e'.mid$, 则 $e' = emit(cid, id', mid, t)$ 。则根据 *take* 迁移中 *val* 函数的定义可知:

$$\langle M^-, t^- \rangle \xrightarrow{rt(e')} \langle M', t \rangle$$

因此, 本情形下, (1) 成立。

c) 其他情形可以通过同样类似分析, 得到相同结论。

(2) $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 是完整的迁移迹。

由于 *Net* 模型中不存在其他内部迁移事件, 当 $\overline{\sigma}$ 为完整的运行迹时, 即不存在更多的运行, 故 *Net* 不存在更多的迁移事件, 即 $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 是完整的迁移迹。

综上所述, 引理 1 成立。

引理 2 (Storm 计算可靠性与运行迹) 给定 Storm 计算拓扑 *stp*, 若 *stp* 是计算可靠的, 则对于任意 *stp* 的运行迹 $\overline{\sigma}$, $\overline{\sigma}$ 满足如下条件:

- (停机) 对于 $\overline{\sigma}$ 中任意 *semit* 事件, 都有以 *mid* 为关联的 *sFail* 或 *sAck* 事件相对应;
- (正确停机) 若 *sAck* 事件出现在 $\overline{\sigma}$ 中, 则必为 $\overline{\sigma}$ 中的最后事件;
- (bolt 处理正确) $\overline{\sigma}$ 中每个 *take* 事件都有以 *mid* 为关联的 *ack* 或 *fail* 事件;
- (通讯正常) 若 $\overline{\sigma}$ 中未包含 *sFail* 事件, 则 $\overline{\sigma}$ 中每个 *emit* 事件都有和其流依赖的组件的 *take* 事件对应。

证明: 使用反证法证明, 分为以下四步:

设 $\overline{\sigma}$ 为 *stp* 关于数据 *v* 的完整运行迹。

(1) $\overline{\sigma}$ 满足停机条件。

假设 $\overline{\sigma}$ 中存在 *semit* 事件, 但不存在对应的 *sFail* 及 *sAck*。则根据引理 1, *Net* 存在完整运行迹 $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 。

由于 *sFail*, *sAck* 事件未出现在 $\overline{\sigma}$ 中, 则 $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 中不存在 *sFail*, *sAck* 类型迁移。故 *Net* 中的 *sAck*, *sFail* 满足 $M_f(sAck) = M_f(sFail) = \emptyset$, 从而 *Net* 关于 *v* 的完整迁移迹是不可靠的。矛盾, 故 (1) 成立。

(2) $\overline{\sigma}$ 满足正确停机条件。

假设 *sAck* 事件出现在 $\overline{\sigma}$ 中, 但不是最后的事件。不妨设最后事件为 *e*。根据引理 1 可知, *Net* 存在关于数据 *v* 的完整迁移迹 $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 。其中最后迁移为 $rt(e) = te$ 。*te* 不是 *sAck*, *sFail* 迁移。当 *te* 为其他任何迁移时, 必存在库所 p' ($p' \notin \{sAck, sFail\}$), 使得 $M_f(p') \neq \emptyset$, 显然, 此时 $\overline{rt}(\overline{\sigma})$ 对 *v* 的计算是不可靠的。矛盾, 故 (2) 成立。

(3) $\overline{\sigma}$ 满足每个 bolt 正确处理条件。

假设 $\overline{\sigma}$ 中存在一个 *cid* 的 bolt, 其中 *take* 事件没有对应的 *ack* 和 *fail* 事件。则根据引理 1 可知, *Net* 存在完整运行迹 $\overline{\sigma} = \overline{rt}(\overline{\sigma})$, 满足 *take(cid)* 迁移发生, 而 *ack(cid)*, *fail(cid)* 迁移未发生。则由 bolt 的语义可知, $M_f(ready_{cid}) = \emptyset$, 从而 $\overline{\sigma}$ 不是 *Net* 可靠的运行迹。矛盾, 因此 (3) 成立。

(4) $\overline{\sigma}$ 满足通讯正常条件

假设 $\overline{\sigma}$ 中存在某个 *emit* 事件 *e*, 不存在后续关联的 *take* 事件 *tk*, 不妨设 $e = semit(cid, id, mid, sid, t)$, $tk = take(cid', id, mid, sid, t')$ 。根据引理 1 可知, 存在 *Net* 迁移迹 σ ,

满足 $rt(e) \in \sigma$ ，且 σ 中不存在 $take(cid')$ 迁移。由于在处理组件中无法发生对元组 id 触发 ack 或 $fail$ 迁移，则在未发生 $sFail$ 迁移的前提下 $M_f(P_{ack_{cid}}) = M_f(P_{fail_{cid}}) = \emptyset$ ，从而 σ 不是计算可靠的迁移迹。矛盾，从而 (4) 成立。

综上所述，引理 2 成立。

定理 1 给定 Storm 计算拓扑 stp ，若 stp 的计算是可靠的，则对任意 stp 的运行迹 $\bar{\sigma}$ ， $\bar{\sigma}$ 满足

$$\bar{\sigma} \models ECL(stp)。$$

证明：根据 ECL 公式的语义及引理 2，可证明该定理。